

DIN EN 1071-1:2003-06 (D)

Hochleistungskeramik - Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten - Teil 1:
Bestimmung der Schichtdicke mit einem Kontaktprofilometer; Deutsche Fassung EN
1071-1:2003

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Grundlagen des Verfahrens	3
4 Geräte	3
5 Probenahme und Vorbereitung der Proben	4
6 Durchführung	4
7 Grenzen für die Stufenhöhe	5
8 Wiederholpräzision	5
9 Prüfbericht	5
Anhang A (informativ) Einfluss des Verstärkungsfaktors und der Nivellierungsabweichung auf die gemessene Schichtdicke	8